



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Paris, 26 février 2018  
N° 351

## NOTE AUX RÉDACTIONS

### Déplacement de Delphine Gény-Stephann à Trappes Pour l'inauguration de l'Institut LNE Nanotech Mardi 27 février

**Delphine Gény-Stephann**, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, inaugurerà mardi 27 février un nouvel institut dédié à la métrologie<sup>1</sup> des nanotechnologies au sein du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

L'Institut LNE-Nanotech bénéficie de plus de 10 années de travail sur les nanomatériaux, réalisé par 7 équipes de recherche. L'objectif de cet institut est de faire progresser les connaissances dans ce domaine afin d'apporter aux industriels ainsi qu'aux laboratoires de recherche et d'analyse les outils nécessaires à la fiabilisation des mesures à l'échelle du nanomètre. Cela permettra de réduire les coûts de l'innovation via une meilleure maîtrise des performances des produits développés, de disposer, pour répondre aux réglementations françaises et européennes, de méthodes d'analyse traçables à des références clairement établies par le LNE, et enfin de soutenir les travaux sur l'évaluation des risques potentiels associés aux nanomatériaux.

L'institut LNE-Nanotech vise à devenir un opérateur de référence, tant au niveau national qu'international.

Lors de cette inauguration, la secrétaire d'État visitera la plateforme, échangera avec le directeur général du LNE, Thomas Grenon, ainsi qu'avec des industriels. Un discours clôturera la visite.

#### Programme

**15h30**

Arrivée de la secrétaire d'État à l'Institut Nanotech

*Site de Trappes du LNE - 29 rue Roger Hennequin, 78197 Trappes*

- Accueil par Thomas Grenon, directeur général du LNE
- Présentation de l'Intelligence Artificielle et de l'Usine du futur
- Visite de la plateforme et échanges avec des industriels
- Discours de la secrétaire d'État

**17h30**

Fin de la visite

**Accréditations auprès d'Alexandre Papin :**  
01 40 43 38 92 - [alexandre.papin@lne.fr](mailto:alexandre.papin@lne.fr)

<sup>1</sup> L'objectif de la métrologie est de développer des méthodes de référence de plus haut niveau dans le but d'assurer une comparabilité de résultats de mesure réalisées dans différents laboratoires et à différentes échelles temporelles. Ces références primaires aux incertitudes réduites permettent de garantir la justesse et la fidélité des résultats grâce à différents niveaux d'étalons qui leur sont raccordés.